

敏锐关注行业动态 加速科研创新实力

——IEEE Xplore 数据库使用指南



IEEE，美国电气电子工程师学会，是目前全球规模最大的科技行业学会。IEEE 目前拥有 40 多万会员，遍布全球 160 多个国家，其业务涉及标准、期刊、会议和教育等多个领域。作为 IEEE 旗下最完整最权威的在线数据资源，IEEE Xplore 平台提供了当今全世界电子电气，通信和计算机科学等领域将近三分之一的文献。其收录的期刊、杂志、会议论文和标准文档高达 3 百余万篇。种类覆盖电子工程、计算机工程、空间技术、生物工程等

IEEE Xplore 数据库涵盖全球科技工程领域前沿研究成果

IEEE Xplore 科技文献代表全球最新最前沿研发动态，其跨学科、多学科的研究成果与解决方案将进一步激发企业产生新的创意与想法，从而转化为创新专利与新型产品。

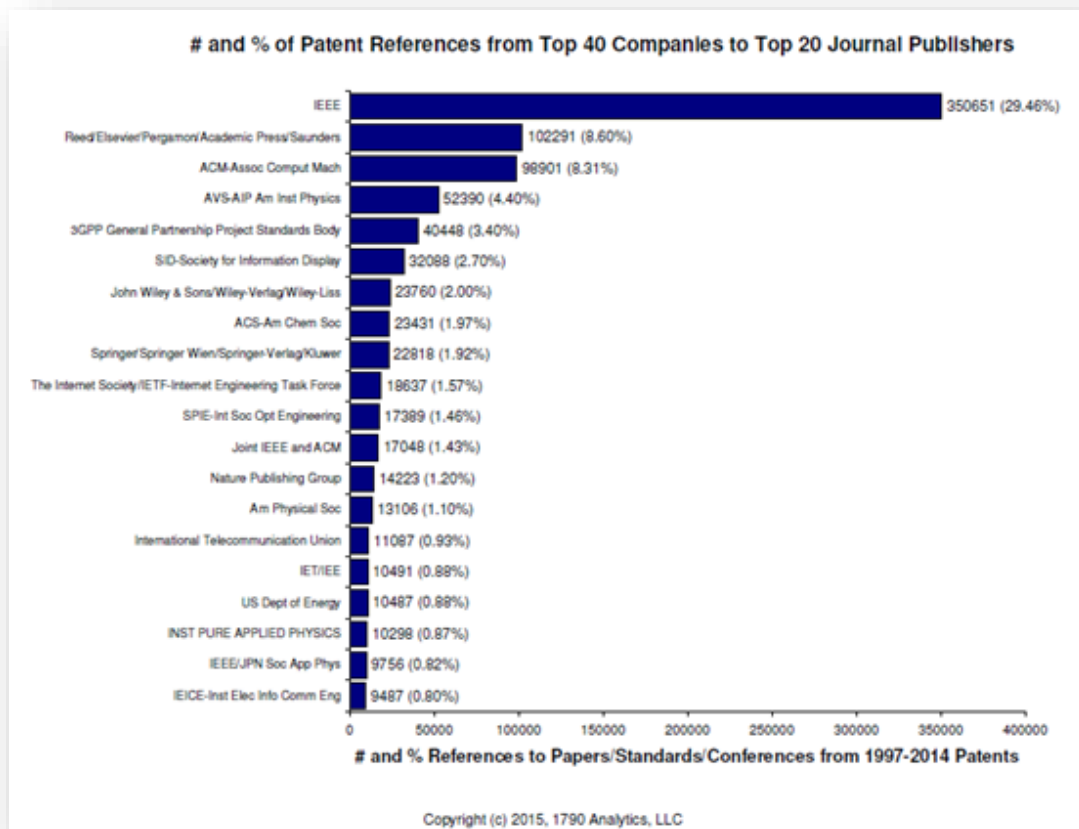
IEEE Xplore 数据库内容包括：

- 170+种 IEEE 期刊与杂志
- 每年 1400+种 IEEE 会议录
- 4500+篇，每年 20+种 VDE 会议录
- 2600+种 IEEE 标准（不含草案）
- 20+种 IET 期刊
- 每年 20+种 IET 会议记录
- 提供 1988 年以后所有文献，部分历史文献回溯到 1872 年
- 提供 IEEE 标准字典

IEEE Xplore 数据库涵盖的学科领域：

- 航空航天
- 遥感
- 电力电子学
- 生物医学工程
- 交通运输
- 半导体
- 通信工程
- 天线
- 机器人自动化
- 量子电子学
- 电子学
- 计算机软件
- 海洋工程
- 光学
- 无线通讯
- 纳米技术
- 能源工程
- 计算机硬件
- 成像技术
- 信息技术
- 信号处理
- 电力系统
- 智能电网
- 汽车工程

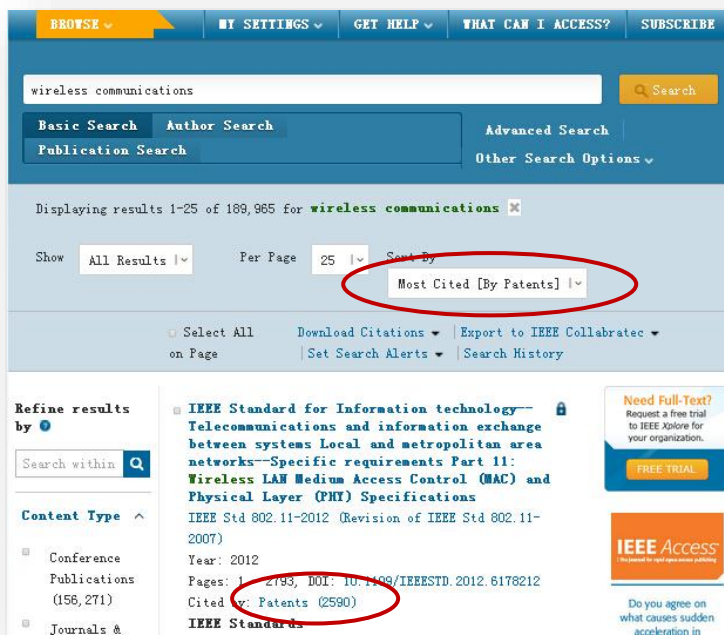
作为全球领先的科技行业学会，IEEE 在推动世界高科技企业研发创新与专利技术转化上起到关键作用。2015 年针对美国专利局专利申请量最多的 40 家全球著名高科技企业的研究表明，IEEE 科技文献被其专利申请文档的引用比例高达 29.46%，领先于其他同类科技出版社 3 倍之多。



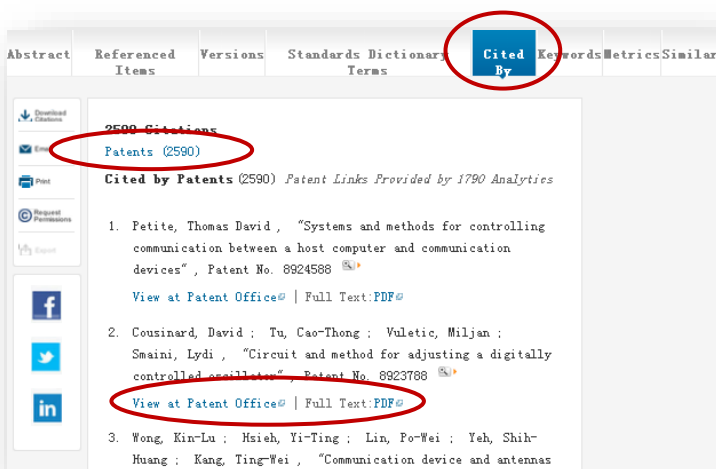
1997-2014 年间美国专利局申请量 Top40 高科技企业对科技类出版社的引用情况列表
来源：1790 Analytics LLC, Copyright 2015

IEEE Xplore 科技文献驱动技术转移和专利申请

在高科技专利领域，IEEE 期刊和会议文献的专利引用量超过 27 万次。自 1997 年以来，IEEE Xplore 科技文献被技术专利引用次数增长了 660%。您可以通过 IEEE Xplore 平台进一步了解被专利引用的高产业影响力文献。IEEE Xplore 平台文摘页面的“cited by”标签中已包含来自美国和欧洲的专利引用情况。同时您也可以链接 USPTO 网站浏览到专利全文。

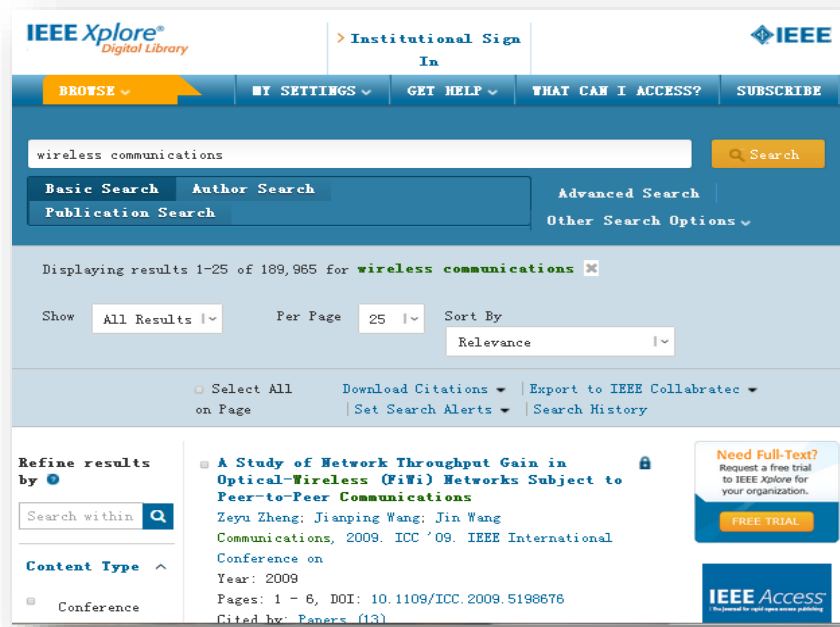


使用“Most Cited (By Patents)”可查看 IEEE 数据库里被专利引用次数最多的高产业影响力文献。

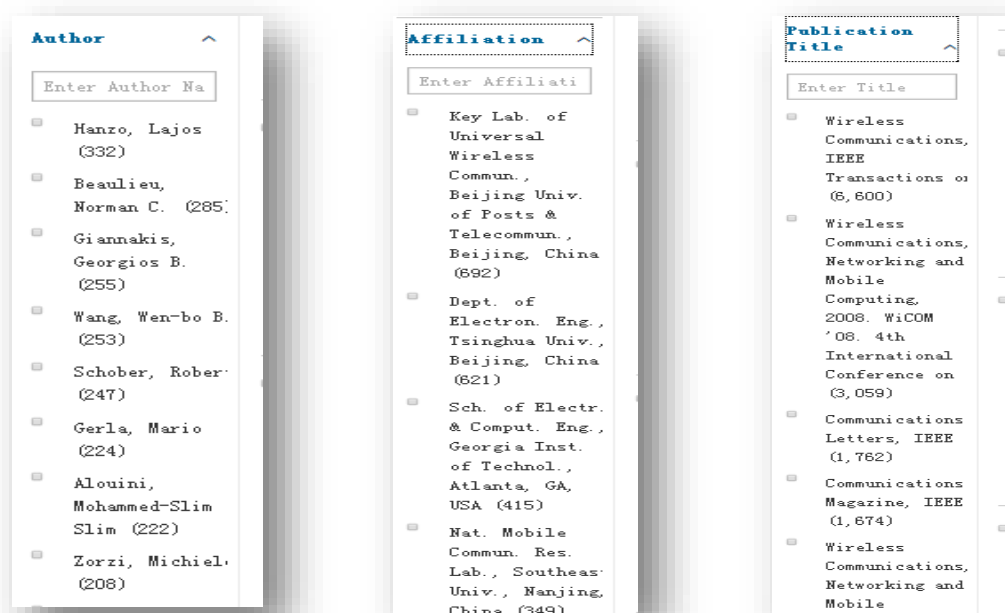


点击“Cited By”查看所有引用 IEEE Xplore 文献的专利，并直接访问美国专利局及欧洲专利局网站获取专利全文。

通过 IEEE Xplore 聚类分析功能，您可以迅速了解某个技术领域研发动态，掌握当前领先的研究者、研究机构以及核心期刊和会议，辅助企业进行深度市场分析，从而做出正确而及时的商业决策。

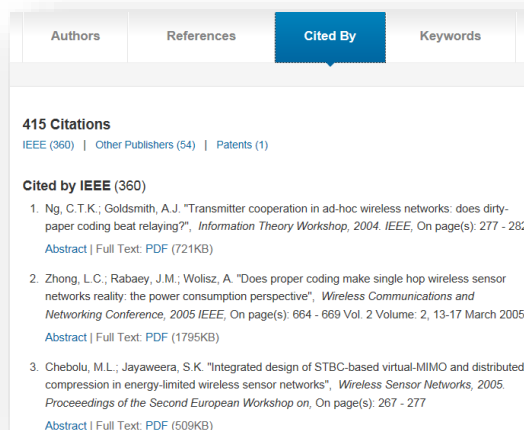
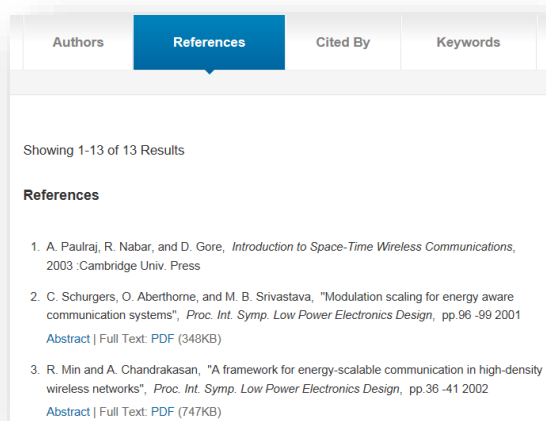


输入您感兴趣的技术领域，可以查看该技术领域最新发展与动态。通过左边“聚类分析”，您可以查看特定时间该领域知名专家、机构以及核心期刊与会议。

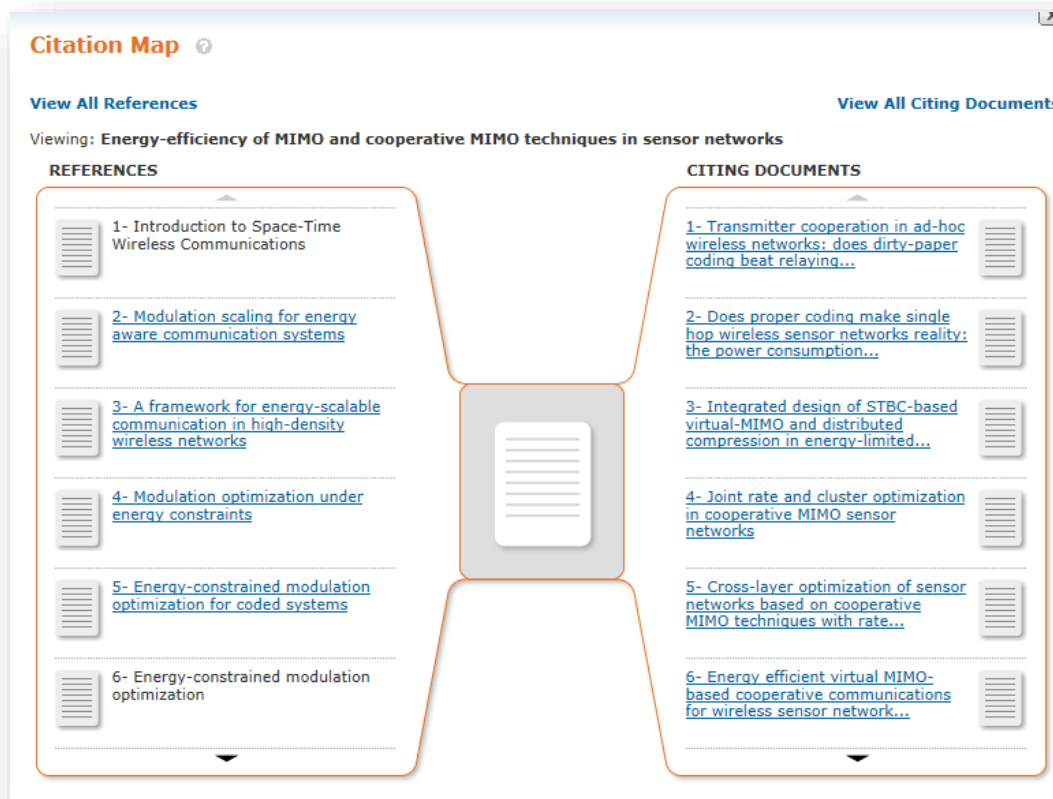


IEEE Xplore 科技文献快速定位技术文档，避免闭门造车而造成研发投入浪费

IEEE Xplore 可以辅助工程师快速有效地定位相关技术文档，向前可以追溯经典科技文献，向后可以查看相关技术最新研究进展，以避免闭门造车而造成公司研发投入浪费，从而也避免未来可能产生的专利纠纷。



通过文摘页面“References”与“Cited By”可以查看每篇文献的引用与被引用文献列表，或点击“Citation Map”更直观形象查看引用图标，从而快速收集最直接相关的核心文献。



IEEE Xplore 数据库帮助企业高效进行竞争对手分析，掌握行业动态

利用 IEEE Xplore 机构检索功能，企业可以随时掌握自身以及竞争对手的研发动态，查看最新研究进展。您可以针对特定技术领域、特定机构或者特定专家定制推送，随时随地按需收取来自 IEEE Xplore 的最新技术文献。

Advanced Search Options

Advanced Keyword/Phrases | Command Search | Citation Search | Preferences

ENTER KEYWORDS OR PHRASES, SELECT FIELDS, AND SELECT OPERATORS
Note: Refresh page to reflect updated preferences.

Search : Metadata Only Full Text & Metadata

intel in Author Affiliations

AND [] in Metadata Only

AND [] in Metadata Only

+ Add New Line | Reset All | SEARCH

使用“高级检索”里的“Author Affiliation”字段，可针对特定公司研发成果与动态进行检索，从而进行内部与外部竞争情报收集与分析。

Displaying results 1-25 of 5,781 for **(*Author Affiliations*:intel)**

Show All Results | Per Page 25 | Sort By Relevance

Select All on Page | Download Citations | Export to IEEE Collabratec | Set Search Alerts | Search History

Refine results by

Search within result

Content Type

- Conference Publications (4,454)
- Journals & Magazines (1,304)

Impact of residue on Al/Si pads on gold bonding
Ahmad, S.
Electronics Components Conference, 1988., Proceedings of the 38th
Year: 1988
Pages: 534 - 538, DOI: 10.1109/ECC.1988.12644
Cited by: Patents (10)
IEEE Conference Publications
Abstract (400 Kb)

Numerical study of conjugate heat transfer in stacked microchannels
Patterson, M.K.; Xiaojin Wei; Joshi, Y.; Prasher, R.

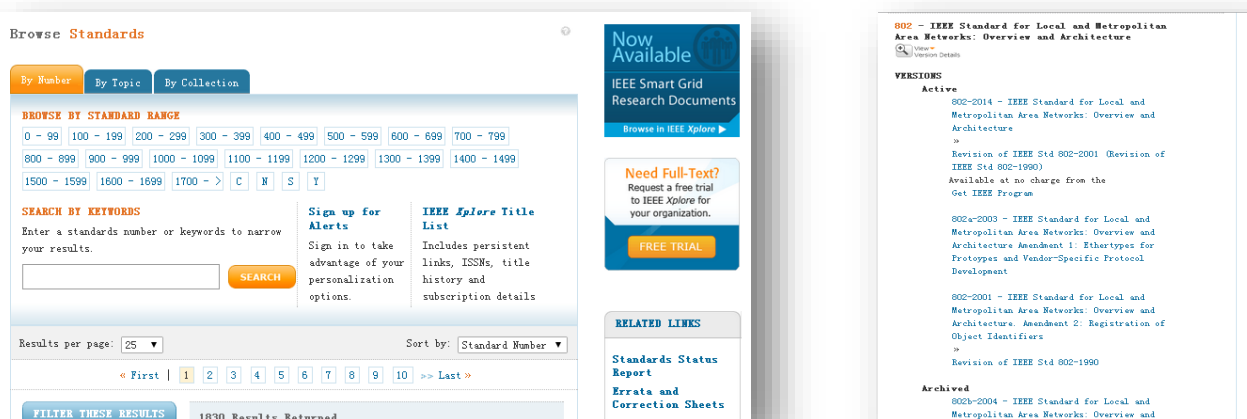
Set Alert
Search Alert Name* intel-research
Email Address flyfloral919@foxmail.com
Cancel Save

在个人账户里针对特定公司、特定专家和特定领域进行检索式定制保存“Saved Search”，将随时收到最新行业动态和监测公司研发进展。

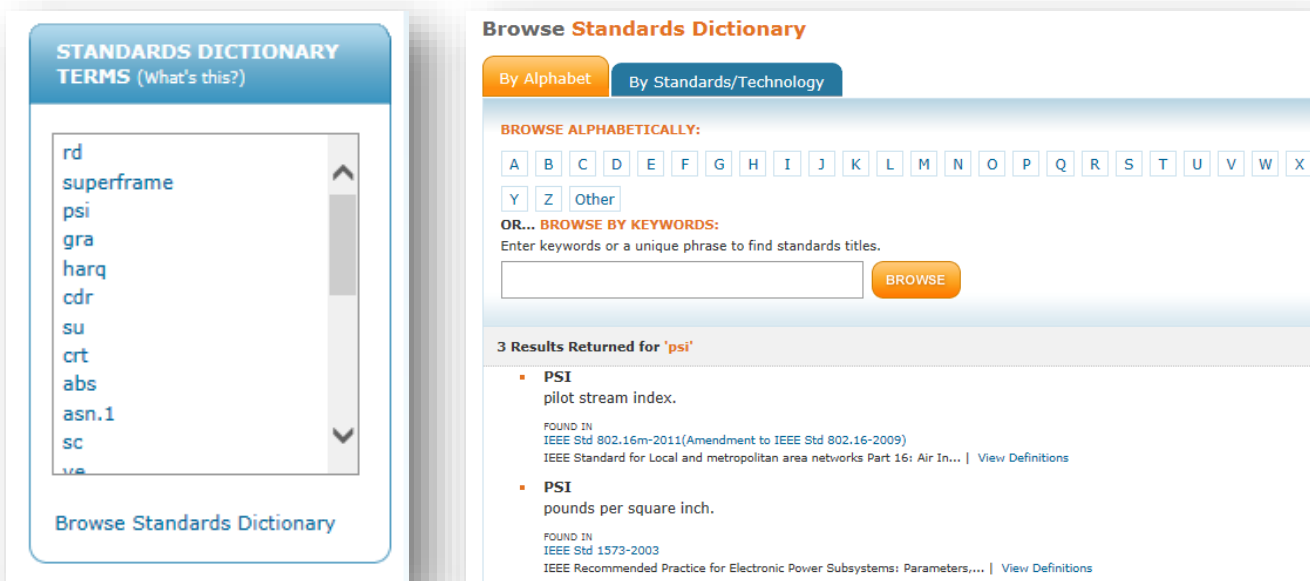
IEEE Xplore 数据库确保企业产品与工业流程符合国际标准，更快进入国际市场

作为国际知名的行业标准开发组织，IEEE 目前拥有 1000 多种现行标准以及 500 多个正在进行的草案标准。所有 5000 多种标准文档全部汇聚在 IEEE Xplore 平台上，从而确保企业研发产品与工业流程符合国际标准，更快进入国际市场。

您可以通过“Browse Standards”按标准号、主题以及订购内容查看标准文档以及每个标准文档版本历史。

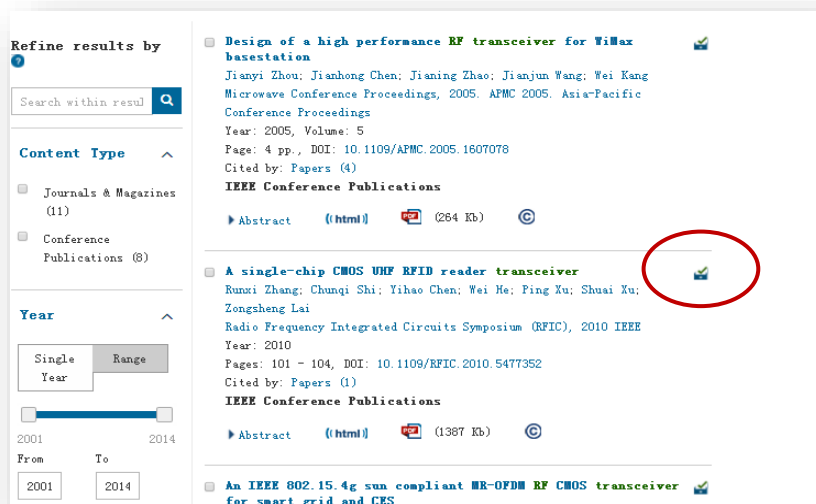
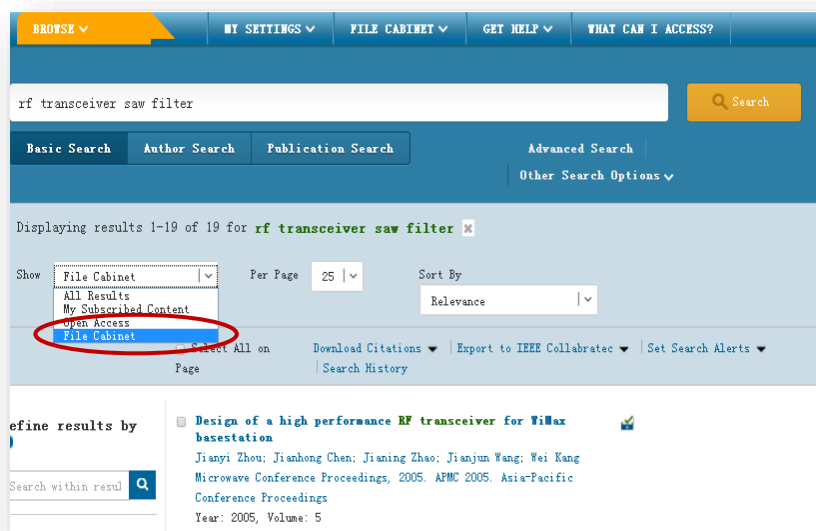


您可以通过“Standards Dictionary”查看来自 IEEE 标准文档里的所有 4 万多个词条，包括所有的简称、缩写和关键词。



全新文件夹"File Cabinet" 促进公司团队合作与知识共享

改版后的“File Cabinet”（文件夹）为公司内部团队合作提供一个更为灵活有效的知识共享空间，快速查看其它成员关注内容，下载文献再使用更加清晰直观。



IEEE Xplore 科技文献 ROI 分析报告-通过智能检索提高 ROI

节省研发人员的时间就意味着节省公司金钱。IEEE 最近对 10 个技术领域的 1000 多名工程师进行访谈，发现 IEEE 数据库对于工程师完成复杂项目以及快速准确决策至关重要。

IEEE Xplore 可以节省工程师多少时间？

- 75% 的工程师提到在 30 分钟以内可以找到一篇极为相关的重要文献
- 75%的工程师提到如果没有 IEEE Xplore 的话同样任务则需要一天以上
- 60%的工程师提到不太可能在 IEEE Xplore 以外的地方找到同样质量的文献

工程师如何受益于 IEEE Xplore?

IEEE Xplore 可以:

- 提高日常工作效率
- 改善既有流程与开发模式
- 鼓励创新性思维更加有效地解决问题
- 保持对前沿技术的关注

IEEE *Xplore* 平台访问:

<http://ieeexlore.ieee.org>

产品咨询:

Tel: 010-82331971-855

Email: iel@igroup.com.cn

产品培训:

Email: li.q@ieee.org

售后服务:

Tel: 021-64453167-8017

Email: iel@igroup.com.cn

The Most Essential Information in Technology Today